

ProView™ XD 光纤端面质量检测干涉仪/显微镜（用于连接器 光纤包层直径 220–1200μm）



产品描述

ProView XD 是一款高度先进的干涉仪，用于精确测量和检查直径为 220 至 1200μm 的光纤端面。干涉仪是专门为生产线设计的，在生产线上需要简单、快速和非常准确的端面检测。但 ProView XD 也非常适合研发环境和连接器维护目的。在许多情况下，干涉条纹图案可以非常复杂地进行分析和理解。为了便于使用和优化检查速度，ProView XD 包括高度先进的全自动功能，用于端面表面的 2D 和 3D 地形分析。

产品特点

For end fac 适用于直径为 220 至 1200 μm 的端面、2D 和 3D 地形、PC 控制器 GUI 的条纹和检查模式、通过自动角度估计，检测速度非常快、可选择使用通过/失败半径和角度指示、检查端面特性，如平面度、垂直度、锯齿和污染、抓取并保存 2D 和 3D 图像以及连接器数据

产品型号

IF-12-01001



核心参数

尺寸	光纤直径	视野
86(宽) x 127(长) x 93(高) mm	220 μ m – 1200 μ m	~1300 μ m

详细参数

技术参数

尺寸:	86(宽) x 127(长) x 93(高) mm 86(宽) x 140(长) x 97(高) mm (包括, 对焦旋钮和橡胶脚)
重量:	1.2 kg
电源供应:	通过 USB 端口
接口:	超高速 USB (USB 3.0) Type-A, 2 米数据线
环境:	工作温度:10°C ~ 40°C 存储温度:-20°C ~ 50°C 湿度:5% ~ 95% RH(无冷凝)
光纤直径:	220 μ m – 1200 μ m
视野:	~ 1300 μ m
分辨率:	2560 x 1920 (4.92 MP)
传感器:	互补金属氧化物半导体(单色)
图像文件格式:	JPEG, PNG, TIFF, GIF



系统采集范围和精度

高度, 峰谷波值:	15 μm
角度, 220 μm 光纤:	高达 3.9°
角度, 400 μm 光纤:	高达 2.1°
角度, 720 μm 光纤:	高达 1.2°
角度, 1200 μm 光纤:	高达 0.7°
角度对精度: (1)	0.03°标准偏差 (<400 μm , ROI = 90%) 0.02° 标准偏差 (>400 μm , ROI = 90%)
相对精度: (1)	5% 高达 2°

(1) 采用软件标定补偿。

系统要求

电脑:	装有英特尔 i5(或更高版本)的个人电脑
USB: (2)	一个免费的 USB 3.0 接口(超高速)
内存:	4GB 内存(推荐 16GB 内存)
磁盘空间:	100 MB (建议 500MB)
操作系统:	Windows 8/8. 1/10 64 位(使用.net Framework 4.8 或更高版本)
显卡:	支持 3D 图形(推荐专用 GPU)
显示分辨率	1920 x 1080 (推荐双监控系统)
输入设备:	键盘和三键滚轮鼠标(或同等设备)

(2) 仅使用直接连接到 PC 主板的 USB 3.0 端口 (即不带内部延长线的端口)。

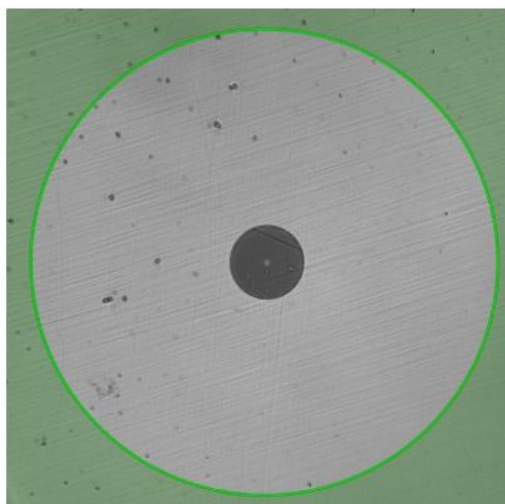
产品配置

型号及包装

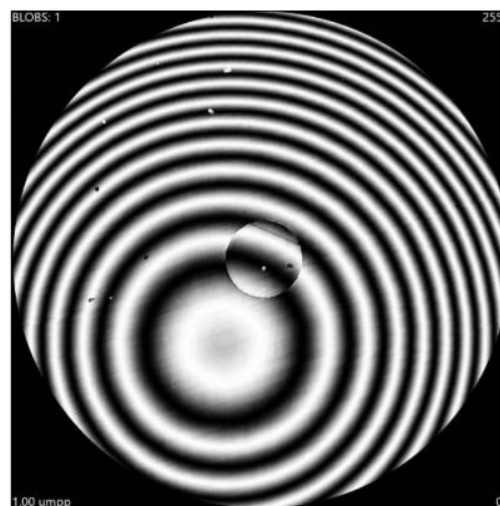
产品	型号 #	数量
NorthLab ProView™ XD –用于 SMA 连接器	IF-12-01001	
NorthLab ProView™ XD – 用于 FC/PC 连接器	IF-12-01002	
NorthLab ProView™ XD – 用于 ST/PC 连接器	IF-12-01003	
NorthLab ProView™ XD – 用于 LD80 连接器	IF-12-01004	
标准包装		
USB 3.0 线缆	N/A	1
用户手册和 PC 软件	N/A	1
配件和备件		
通用 v 形槽夹	IF-90-01004	
SMA 连接器座	IF-90-01010	
FC/PC 连接器支架	IF-90-01011	

ST/PC 连接器支架	IF-90-01012	
LD80 连接器支架	IF-90-01013	

显微镜视图,干涉仪视图

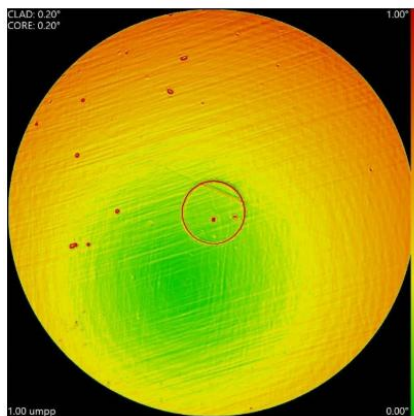


MICROSCOPE VIEW

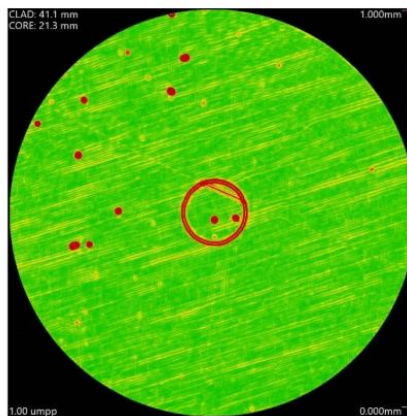


INTERFEROMETER VIEW

角度图视图,曲线图视图

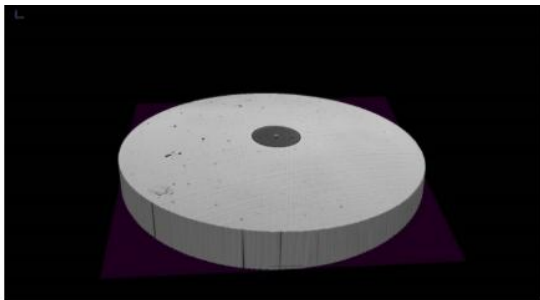


ANGLE MAP VIEW

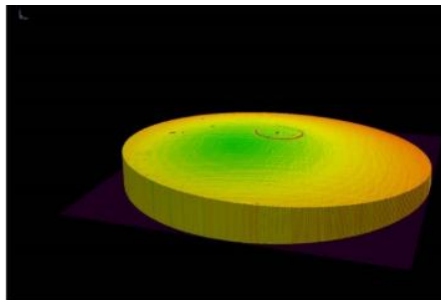


CURVE MAP VIEW

3D 模型视图 ,3D 模型视图



3D MODEL VIEW



3D MODEL VIEW

实拍图

